# FUROPEAN PATENT OFFICE

## **Patent Abstracts of Japan**

PUBLICATION NUMBER

62242378

**PUBLICATION DATE** 

22-10-87

APPLICATION DATE

14-04-86

APPLICATION NUMBER

61085722

APPLICANT: KOMATSU LTD;

INVENTOR:

YAMAGUCHI TADAYOSHI;

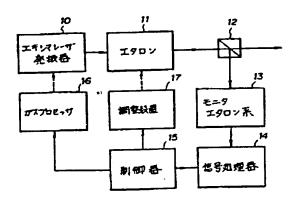
INT.CL.

H01S 3/102 H01S 3/094 H01S 3/105

TITLE

CONTROLLING METHOD FOR

WAVELENGTH OF LASER LIGHT



ABSTRACT :

PURPOSE: To control the wavelength of a laser light beam without using a spectroscope by making part of oscillated laser light beams fall on an optical means of forming interference fringes, and by changing the wavelength of the oscillated laser light beams so that the position of the interference fringes be coincident with a position relevant to a target wavelength.

CONSTITUTION: An excimer laser oscillator 10 oscillates laser light beams having a wavelength of an ultraviolet area, and an etalon, one of wavelength selecting means, allows only laser light beams of specified wavelength to pass through, while a beam splitter 12 splits incident laser light beams, leading one of them to a main use and the other to a monitor etalon system 13. Interference fringes are formed on a detecting plane, and a line image sensor 13c supplies a signal processor 14 with informations on the position and intervals of these interference fringes. The signal processor 14 compares a found wavelength with a target wavelength and delivers a control signal to a controller 15 so as to make the oscillated wavelength coincide with the target wavelength. The controller 15 gives a control to a gas processor 16 or an adjusting unit 17 or to both of them.

COPYRIGHT: (C)1987,JPO&Japio

THIS PAGE BLANK (USPTO)

### ⑲ 日 本 国 特 許 庁 (JP)

①特許出願公開

### ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62 - 242378

@Int\_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

@公開 昭和62年(1987)10月22日

3/102 H 01 S

3/094 3/105 7630-5F 7630-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁) 7630-5F

図発明の名称

レーザ光の波長制御方法

康

康

雅 彦

願 昭61-85722 ②特

夫

理

義

願 昭61(1986)4月14日 **22**出

昭和60年12月20日 社団法人発明協会発行の発明協会公開技報により発表 特許法第30条第1項適用

砂発 明 梶 ш 者

平塚市高村203-14-406

砂発 明 斉 藤 倉 板

平塚市万田18

⑫発 明 平塚市万田18

⑫発 明 若 林 平塚市万田18

若 79発明 者 小

平塚市万田18

忠 砂発 眀 者 株式会社小松製作所 切出 願 人

平塚市北金目1214-7 東京都港区赤坂2丁目3番6号

②代 理 弁理士 木村

#### 1. 発明の名称

レーザ光の波長制御方法

#### 2. 特許請求の範囲

発振レーザ光の一部を、眩レーザ光の皮長に対 応した位置に干渉縞を形成する光学手段に入射さ せ、前記干渉縞の位置が目標被長に関連した位置 と一致するように前記発摄レーザ光の彼長を変更 する手段を制御することを特徴とするレーザ光の 波長制御方法。

#### 3. 発明の詳細な説明

#### ( 産業上の利用分野 )

本発明はレーザ光の波長制御方法に関する。

#### 〔従来の技術〕

従来、レーザ光の波長を知るためには、第5図 に示すようにレーザ光源1から出射したレーザ光 **をレンズ・フィルタ等の前処理系2で加工し、分**  光器3に適した光として分光器3の入射スリット 3 aに導入し、分光器3中の回折格子4b、3c (あるいはプリズム)と回転ステージにより決め られた方向へ光を導き、出射スリット3dから光 が出てきた時を信号処理器4で検知し、このとき の回転ステージの角度(回転ステージの角度と放 長との関係は予め検定されている)からレーザ光 の波長を検知する。

したがって、レーザ光の放長を所定の放長とな るように制御する場合には、予め所留の放長のレ ーザ光が入射するとき、出射スリット3dから光 が出るように回転ステージの角度を調整しておき、 レーザ光が前記出射スリット3 4 から出るように そのレーザ光の波長を放長選択手段(例えば調整 可能なエタロン)などによって同定する。

#### [発明が解決しようとする問題点]

しかし、分光器を用いて放長を同定する場合、 必ず煩雑なアライメント作業が伴い、また良い分 析結果を得るためには大型の分光器が必要となり、 装置が大がかりかつ高価になる。

(2)

本発明は上配実情に鑑みてなされたもので、分 光器を用いずにレーザ光の波長制御を行なうこと ができるレーザ光の波長制御方法を提供すること を目的とする。

(問題点を解決するための手段および作用)

本発明によれば、発振レーザ光の一部を、診レーザ光の波長に対応した位置に干渉縞を形成する 光学手段に入射させ、この干渉縞の位置が目標放 長に関連した位置と一致するように発振レーザ光 の放長を変更する手段を制御するようにしている。 〔突施例〕

以下、本発明を添付図面を参照して詳細に説明 する。

第1図は、本発明の一実施例を示す概略図で、 エキシマレーザ発振器10、エタロン11、ピームス プリッタ12、モニタエタロン系13、信号処理器14、 制御器15、ガスプロセッサ16および調整装置17か ら構成されている。

エキシマレーザ発振器10は紫外域の液長を有するレーザ光を発振し、波長週択手段の1つである

(3)

ある。

第 2 図(a)より、 $\theta$ は  $\tan^{-1}$ ( $r_1$ /x)で得られるので、 $r_1$  の値(干渉縞の位置)を知ることができれば、上配第(1)式に基づいて放長  $\lambda$  を知ることができる。今、 $r_1$  = 0.587 mm ,  $r_2$  = 1.827 mm ,  $r_3$  = 2.516 mm ,  $R_4$  = 3.054 mm ,  $r_0$  = 3.510 mm が得られたとすると、 $\nu$  ー ザ光の放長は上式より  $\lambda$  = 248.35  $\alpha$  m が得られる。

たお、第2 図中の13 a に球面レンズの代りにシリンドリカルレンズを使用しても良い。 この場合得られる干渉縞は(c)のような平行線のものである。 (b) の同心円の干渉縞と(c)の平行線の干渉縞では(c) の方が縞に曲率のない分だけ高い精度で位置検出が可能である。

信号処理器14には予め目積波長が与えられており、信号処理器14は上紀のようにして求めた波長と目標波長とを比較し、発掘波長が目標波長と一致するように制御器15に制御信号を出力する。

制御器15は、信号処理器14から加えられる信号 に基づいてレーザ光の波長が目録波長に一致する エタロン11は、入射する上記レーザ光のうち、特定の波長のレーザ光のみを通過させる。ピームスプリッタ12は入射するレーザ光を分割し、一方は主用途(例えば縮小投影線光装置)へ、他方はモニタエタロン系13に導く。

モニタエタロン系13は第2図(a)に示すようにレンズ13a、エタロン13bおよびラインイメージセンサ13cから構成され、レンズ13aは入射したレーザ光を拡大し、エタロン13bを介してラインイメージセンサ13cの検出而上に入射させる。この検出而上には、第2図(b)に示すように干渉縞が形成され、ラインイメージセンサ13cはこの干渉縞の位置・間隔の情報を信号処理器14に送る。

信号処理器14は、まず上配入力情報からレーザ 光の疲長を求める。すなわち、エクロン13 b は、 水式。

(4)

ようにガスプロセッサ16または調整装置17若しくはその両方に対して制御をかける。

すなわち、エキシマレーザ発振器10は、その発振媒体であるガスの混合比に応じた放長のレーザ光を発振するが、上記ガスプロセッサ16は混合成分ガスの供給ラインに配置されたマスフローコントローラ・世磁弁等の開閉及びその時間間隔を制動してガス組成を変更し、これによってレーザ光の波長を目標液長に向って移動させる。

また、エタロン11はレーザ光の入射角の変化に 応じて通過するレーザ光の放長を変化させること ができる。 調整装置 17は、例えばこのエタロン11 を回転させるズテップモータ等からなり、前記信 号処理器 14から加えられる信号(パルス信号)に よりエタロン11の回転角を制御し、これによって レーザ光の放長を目標放長に向って移動させる。 なお、エタロン11によって放長制御する場合、上 記回転角制御に限らず、エタロン11のギャップ 加額を変更するようにしてもよい。

(5)

-428-

(6)

なお、信号処理器14 は必ずしも放長を求める必要はなく、予めモニタエクロン系13 に目標放長のレーザ光が入射するときに形成される干海縞の位置を記憶しておき、検出した干渉縞の位置が上記記憶した位置に形成されるように制御信号を出力するようにしてもよい。

また、上記実施例では、ビームスブリッタ12に よってレーザ光を分割し、モニタエタロン系13の レンズ13 aを介してレーザ光を拡大してエタロン 13 b に入射させるようにしたが、これに代えて光 ファイバを用いるようにしてもよい。すなわち、 光ファイバの一端を発振レーザ光束中に入れ、他 毎端をエタロン13 b の前方所定位個に対峙させる。

一方、モニタエタロン系13の代わりに、マイケルソン干渉計を用いてもよい。第3四に示すようにマイケルソン干渉計20は、2枚のレンズ21・22、2枚の全反射ミラー23・24およびビームスブリッタ25から構成されている。今、ミラー23・24が点0から等距離にある場合は、ビームスブリッタ25によって等分されたレーザ光が等しい光路を通過

(7)

波長にピークを有する信号パターンを得るように してもよい。

第4 図は色素レーザの液長制御を行なう装置の 実施例を示す。なお、第1 図と同一簡所には同じ 番号を付し、その詳細な脱明は省略する。

同図において、色素レーザ31はエキシマレーザ、 YAGレーザ等の励起レーザ30によって光ポンピ ングを行ないレーザ光を発掘する。そして、調整 装置32は、制御器15からの信号によりそのレーザ 光の発振波長が目標放長となるように色素レーザ 31のステージを駆動する。なお、色素レーザ31の 密媒の種類あるいは優度を調整して発振波長を制 御するようにしてもよい。

なお、本実施例では、制御器15によってガスプロセッサ16や課整装置17を自動的に制御し、発振波長を目標波長に一致させるようにしているが、オペレータが定期的にガスプロセッサ16や調整装置17を手動で網整して発振波長を目標波長に一致させるようにしてもよい。

(発明の効果)

した後、結像面25に到着するため、この結像面に は入射光の像がそのまま現れる。 なお、 レンズの 倍率によりサイズは変化することがある。

ことで、一方のミラー24を $\Delta$ h だけ後方に移動させると、ミラー24で反射された光は、 $2\Delta$ h cos  $\theta$  分だけ長い光路を通過した後、結像面26に到着するため、この増加分の光路長が放長  $\lambda$  に対して次式。

 $2\Delta h \cos \theta = m \lambda$  ----------- (2) を満足すれば、この $\theta$  の位置では光は強め合い、 結像面26ではこの $\theta$  に関連する半色 f,  $\tan \theta$  の 明るい円理を作る。

上記第(2)式からも明らかなように逆に△hを特定の値(1至とか0.1至)に固定した場合、波長人の変化によりℓ、つまり円壌の半径が変化することになる。

したがって、結像面26にラインイメージセンサを配置し、このラインイメージセンサにより明るい円環を検出するようにすれば、液長の変化を電気的に検出したことになる。

(8)

以上説明したように本発明によれば、分光器を使用する必要がなくなるため装置が簡略になる。また、被長検知部分の装置は従来の大型の分光器に対して価格の面でも1桁ぐらい安価に構成できる。さらに、縮小投影露光用光源として本発明に係るレーザ光を用いると、観光波長を所定の彼長に特度よく固定できるため、フォーカスエラーがなくなり歩留りがよくなる。

### 4. 図面の簡単な説明

第1 図は、本発明の一実施例を示す概略図、第2 図(a),(b)および(c)はそれぞれ第1 図のモニタエタロン系を説明するために用いた図、第3 図はマイケルソン干渉計を示す図、第4 図は本発明による他の創御対象レーザを示す概略図、第5 図は従来装置を示す既略図である。

10…エキシマレーザ発掘器、11、13 b …エタロン、12…ビームスプリッタ、13…モニタエタロン系、13 a …レンズ、13 c …ラインイメージセンサ、14…信号処理器、15ー制御器、16…ガスプロセッ

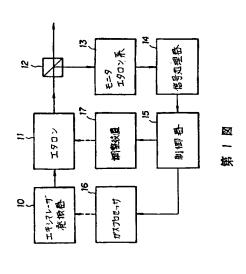
(10)

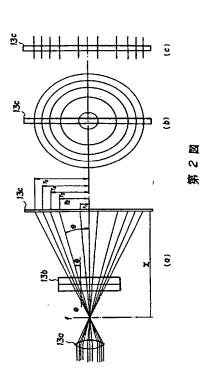
特開昭62-242378(4)

サポップ … 胸乾装置、20 … マイケルソン干渉計、30 … 励起レーザ、31 … 色素レーザ。

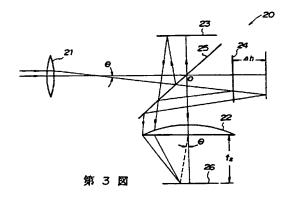
形面 人代理人 木村 高久 (公司)

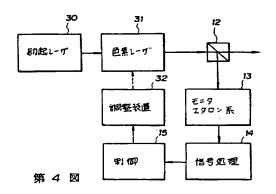
(11)

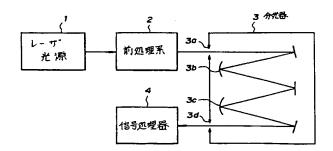




### 特問昭62-242378(5)







第 5 図

